

## LOM3245 - Técnicas Avançadas de Caracterização de Materiais

### *Advanced Techniques for Materials Characterization*

- Créditos-aula: 4
- Créditos-trabalho: 0
- Carga horária: 60 h
- Departamento: Engenharia de Materiais

### Objetivos

Capacitar o aluno em técnicas de microscopia eletrônica de transmissão, microscopia de força atômica e difração de nêutrons.

### Docente(s) Responsável(eis)

- 6495737 - Durval Rodrigues Junior
- 1643715 - Paulo Atsushi Suzuki

### Programa resumido

Microscopia eletrônica de transmissão (MET) e microscopia de força atômica (AFM).

### Programa

Princípios gerais da óptica eletrônica. Conceito de resolução. Constituição e funcionamento do microscópio eletrônico de transmissão. Técnicas de preparo de amostras; ultramicrotomia. Manuseio do microscópio eletrônico de transmissão e ultramicrotomo. Geração de imagens, interpretação e registro Exemplos de aplicações da microscopia eletrônica de transmissão. Fundamentos de microscopia de força atômica (AFM). Instrumentação eletrônica. Modos de AFM. Medição e tratamento de imagens de AFM. Aplicações de AFM.

### Avaliação

- **Método:** Listas de exercícios, provas escritas, apresentação de seminário, aulas de laboratório e preparação de relatórios.
- **Critério:** Média ponderada de duas provas escritas, trabalhos e relatórios: P1, P2 e TR. Conceito Final =  $(P1 + 2P2 + TR)/4$
- **Norma de recuperação:** WILLIAMS, D. B.; CARTER, C. B., Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science, Springer, 2009. WILLIAMS, D. B.; CARTER, C. B., Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science, Springer, 2009. BOZZOLA, J. J.; RUSSELL, L. D. Electron Microscopy, Boston, Jones & Bartlett, 1999. HUNTER, E. Practical Electron Microscopy, Cambridge University Press, 1993. REIMER, L.; KOHL, H., Transmission Electron Microscopy: Physics of Image Formation, Springer, 2008. EATON, P.; WEST, P. Atomic Force Microscopy, Oxford University Press, 2010. MORITA, S.; WIESENDANGER, R.; MEYER, E. Noncontact Atomic Force Microscopy, Springer, 2002.

### Bibliografia

WILLIAMS, D. B.; CARTER, C. B., Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science, Springer, 2009. BOZZOLA, J. J.; RUSSELL, L. D. Electron Microscopy, Boston, Jones & Bartlett, 1999. HUNTER, E. Practical Electron Microscopy, Cambridge University Press, 1993. REIMER, L.; KOHL, H., Transmission Electron Microscopy: Physics of Image Formation, Springer, 2008. EATON, P.; WEST, P. Atomic Force Microscopy, Oxford University Press, 2010. MORITA, S.; WIESENDANGER, R.; MEYER, E. Noncontact Atomic Force Microscopy, Springer, 2002.

### Requisitos

- LOM3229: Métodos Experimentais da Física II (Requisito)
- LOM3246: Técnicas de Caracterização de Materiais (Requisito)

[Ver no Jupiter](#) [Salvar em pdf](#) [Salvar em docx](#)